

研究タイトル: VLSI の高信頼化設計に関する研究



氏名:	岩田 大志 / Hiroshi Iwata	E-mail:	iwata@info.nara-k.ac.jp
職名:	講師	学位:	博士(工学)
所属学会・協会:	電子情報通信学会、IEEE		

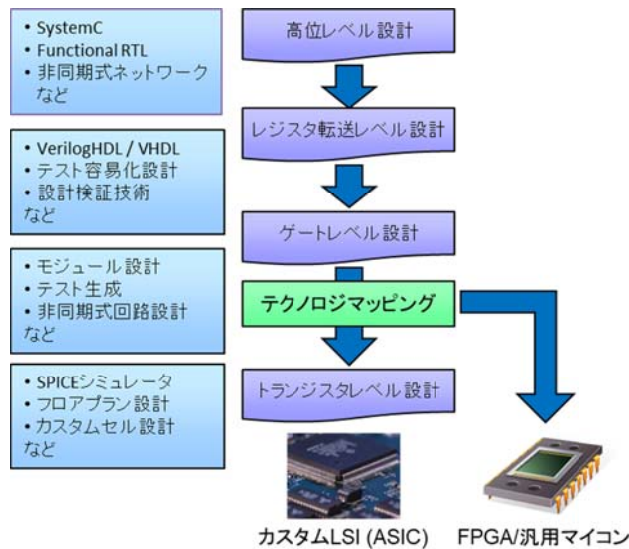
キーワード: CAD / テスト容易化設計 (Design for Testability) / 非同期式回路 (Asynchronous circuit) / IoT

技術相談  
提供可能技術: CAD 技術の活用、導入に関するご相談  
環境センシングなどの IoT 機器開発に関するご相談

研究内容:

- ・高位レベル設計(ソフトウェア)から製品(ハードウェア)までの一貫した高信頼化設計手法
- ・製品の目的に合わせて、高いコストパフォーマンスを実現

VLSI はスマホやPCなどのコンピュータに広く利用されている。また、多様化する社会のニーズに対応した VLSI を設計 / 製造するためには 速くて、安くて、高信頼な設計手法が必要である。  
本研究では、C 言語ライクな設計を可能とする高位レベル記述した回路をカスタム LSI や FPGA などに自動実装する CAD 技術を利用した VLSI 設計を行っている。



提供可能な設備・機器:

名称・型番(メーカー)	